

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用

2SD1950は、シングルタイプのスーパーハイ h_{FE} トランジスタで、低コレクタ飽和電圧で、電力ロスが少ないため、低電源電圧でのモータ、リレー、ランプ等の大電流ドライブ用として最適です。

特 徴

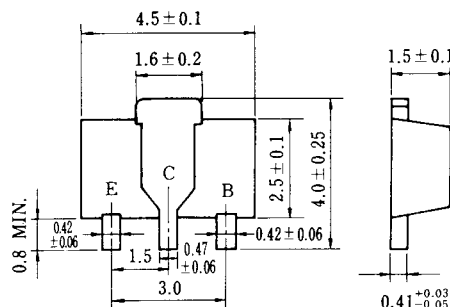
○スーパーハイ h_{FE} です。

$h_{FE}=800\sim 3200$ (@ $V_{CE}=5.0\text{ V}$, $I_C=1.0\text{ A}$)

○低コレクタ飽和電圧です。

$V_{CE(sat)}=0.18\text{ V TYP.}$ (@ $I_C=1.0\text{ A}$, $I_B=10\text{ mA}$)

外形図 (単位: mm)



電極接続

E: Emitter
C: Collector (Fin)
B: Base
(SOT-89)

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	25	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	15	V
コレクタ電流 (直 流)	$I_{C(DC)}$	2.0	A
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	3.0	A
全 損 失	P_T **	2.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	$-50\sim +150$	$^\circ\text{C}$

* $PW \leq 10\text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50\%$

** $16\text{ cm}^2 \times 0.7\text{ mm}$ のセラミック基板使用時

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

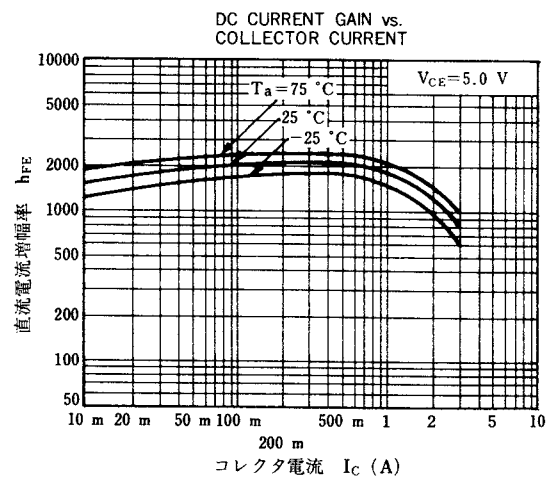
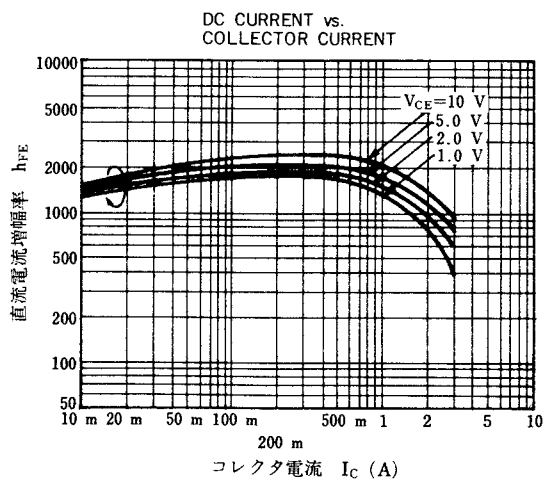
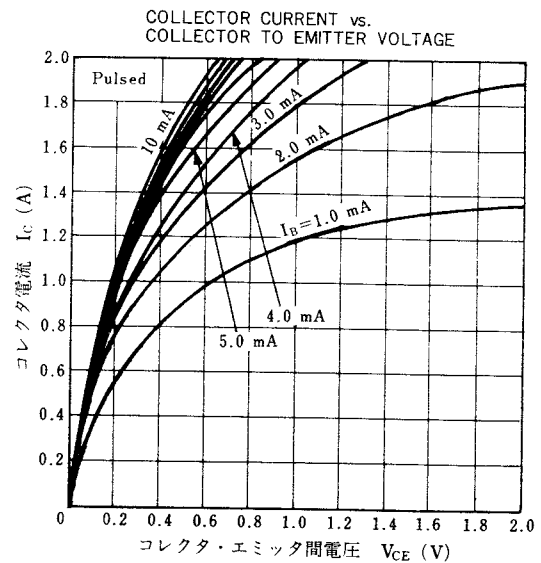
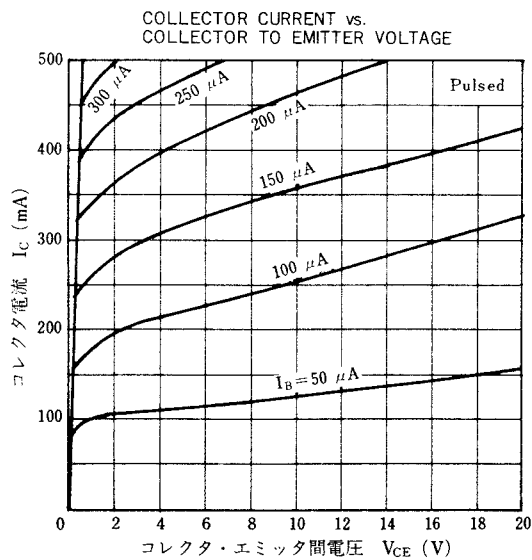
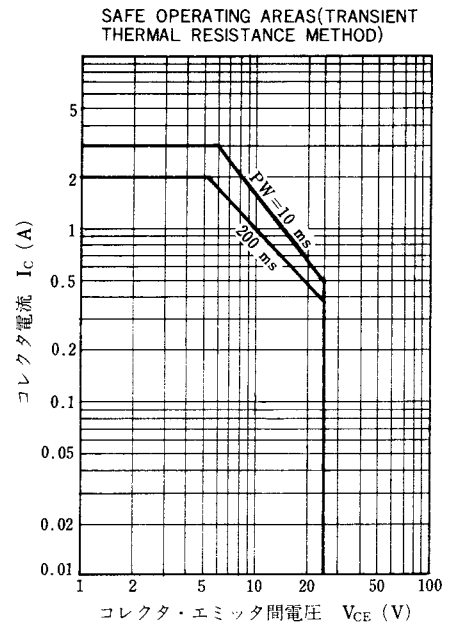
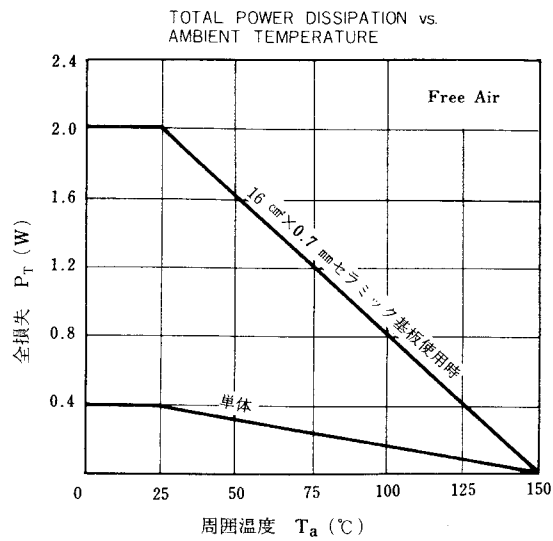
項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=30\text{ V}$, $I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=10\text{ V}$, $I_C=0$			100	nA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1} ***	$V_{CE}=5.0\text{ V}$, $I_C=1.0\text{ A}$	800	1500	3200	
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2} ***	$V_{CE}=5.0\text{ V}$, $I_C=2.0\text{ A}$	400			
直 流 ベ ー ス 電 圧	V_{BE} ***	$V_{CE}=5.0\text{ V}$, $I_C=300\text{ mA}$	600	660	700	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ ***	$I_C=1.0\text{ A}$, $I_B=10\text{ mA}$		0.18	0.30	V
ベ ー ス 飽 和 電 圧	$V_{BE(sat)}$ ***	$I_C=1.0\text{ A}$, $I_B=10\text{ mA}$		0.83	1.2	V
コ レ ク タ 容 量	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{ V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{ MHz}$		26	35	pF
利 得 帯 域 幅 積	f_T	$V_{CE}=10\text{ V}$, $I_E=-500\text{ mA}$	150	350		MHz

***パルス測定 $PW \leq 350\text{ }\mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

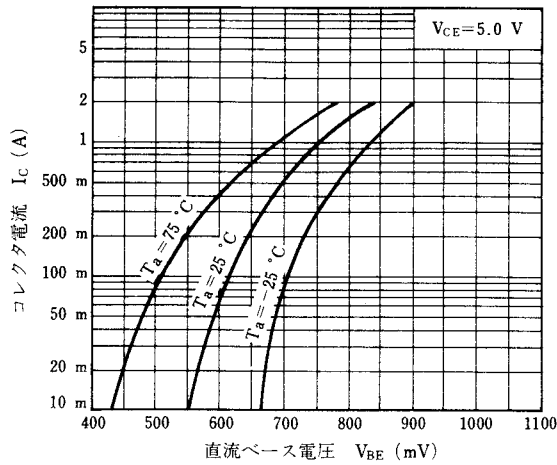
 h_{FE} 規格区分

捺 印	VM	VL	VK
h_{FE1}	800~1600	1200~2400	2000~3200

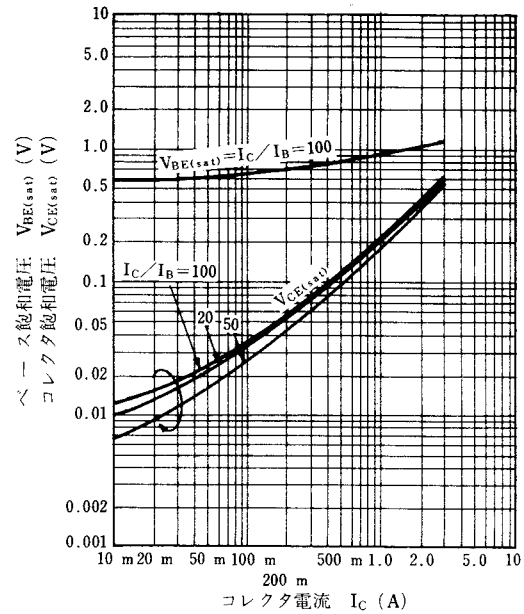
特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)



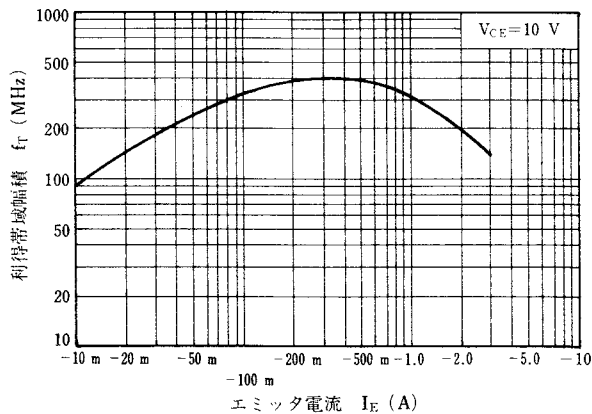
COLLECTOR CURRENT vs.
BASE TO EMITTER VOLTAGE



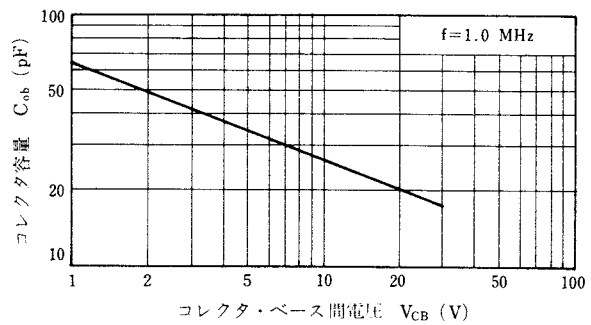
COLLECTOR AND BASE SATURATION
VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs.
EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs.
COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



参考資料

資 料 名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイス パッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
半導体総合セレクション・ガイド	MF-212
パルス電力損失時におけるトランジスタの接合 部温度の算出方法について	TEB-528
トランジスタの E-B 接合ブレイクダウンによる h_{FE} , ノイズ劣化	TEB-537

〔メモ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
- 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
- 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
- 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
- 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.6

— お問い合わせは、最寄りの NEC へ —

【営業関係お問い合わせ先】

半 半 導 体 第 一 三 部
--

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-7914	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2762	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	